

СПИСОК
опубликованных научных работ
Спивак Юлии Михайловны
по специальности
05.11.01 - Приборы и методы измерения

№ п/п	Полное библиографическое наименование публикации	Импакт-фактор журнала	Кол-во цитирований
1	2	3	4
1.	Pastukhov A.I., Belorus A.O., Bukina Ya.V., Spivak Yu.M., Moshnikov V.A. Influence of technology conditions on the surface energy of porous silicon using the method of contact angle // Proceedings of the 2017 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering. 2017. С. 1183-1185.	-	0
2.	Spivak Yu.M., Myakin S.V., Moshnikov V.A., Panov M.F., Belorus A.O., Bobkov A.A. Surface functionality features of porous silicon prepared and treated in different conditions // Journal of Nanomaterials. 2016. Т. 2016. С. 2629582.	1.871	10
3.	Белорус А.О., Букина Я.В., Пастухов А.И., Спивак Ю.М. Исследование сенсорных характеристик слоев пористого кремния для применения в микро- и нанoeлектронике // Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения. 2016. Т. 16. № 2. С. 198-200.	0,077	0
4.	Белорус А.О., Мараева Е.В., Спивак Ю.М. Современные методы анализа параметров пористой структуры материалов. исследование порошков пористого кремния методом капиллярной конденсации. // Известия СПбГЭТУ ЛЭТИ. 2015. Т. 2. С. 11-14.	0,149	6
5.	Belorus A.O., Maraeva E.V., Spivak Y.M., Moshnikov V.A. The study of porous silicon powders by capillary condensation // Journal of Physics: Conference Series. 2015. Т. 586. № 1. С. 012017.	0.45	24
6.	Лашкова Н.А., Пермяков Н.В., Максимов А.И., Спивак Ю.М., Мошников В.А. Анализ локальных областей полупроводниковых нанообъектов методом туннельной атомно-силовой микроскопии // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического	0,073	9

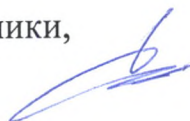
	университета. Физико-математические науки. 2015. № 1 (213). С. 31-42.		
7.	Мошников В.А., Спивак Ю.М., Алексеев П.А., Пермяков Н.В. Атомно-силовая микроскопия для исследования наноструктурированных материалов и приборных структур. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2014. – 144 с	-	23

Индекс Хирша (Web of Science и Scopus/РИНЦ): 7/17

https://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=592367

https://www.researchgate.net/profile/Yulia_Spivak_Kanageeva/reputation

Доцент кафедры микро- и нанoeлектроники,
к.ф.-.м.н.



Ю.М. Спивак
МП

